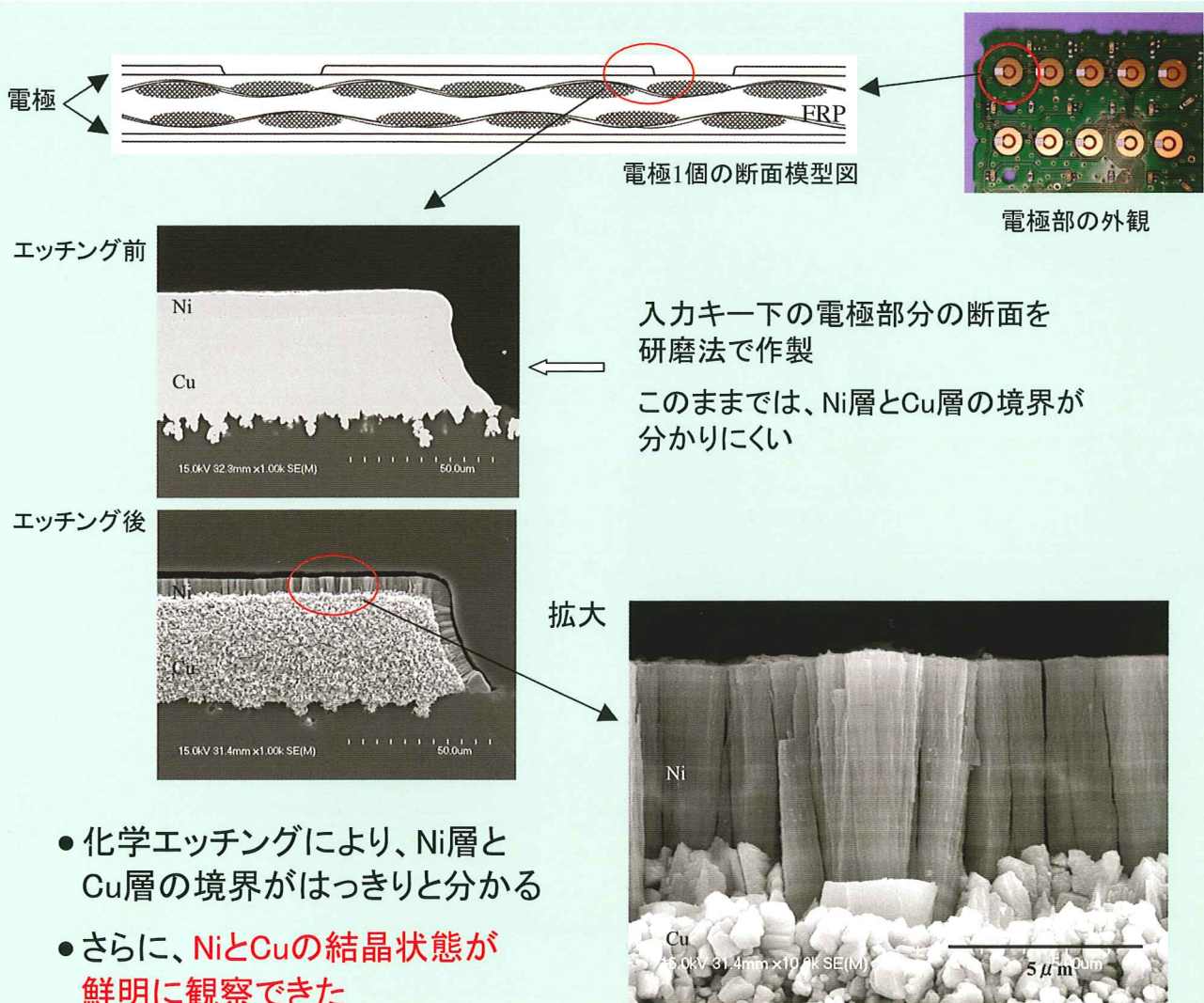


電極部の断面観察(携帯電話の入力キー)

概要

- 携帯電話の入力キーの下にある電極部分の断面観察試料を作製するため研磨法と化学エッチング法を適用し、SEM観察をおこなった。
- 研磨だけでは分からなかったNi膜とCu膜の結晶粒構造が、化学エッチングを施すことによって鮮明に現れた。



株式会社 三井化学分析センター

<http://www.mcanac.co.jp>

営業部 ☎ 03-5524-3851